

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0207U000161

Державний реєстраційний номер: 0105U006992

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 11-01-2007

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Проведення досліджень фізико-технічних характеристик джозефсонівських SINIS ЧИПів.
Розробка вимог до конструкції та метрологічних характеристик вимірювальної установки для дослідження характеристик SINIS ЧИПів.

Початок етапу: 04.2005

Закінчення етапу: 12.2006

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Закрите акціонерне товариство "Науково-виробничий концерн "Наука"

Код за ЄДРПОУ: 25594064

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 246-85-11

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження малорозмірних надпровідникових ґраток для метрології на постійному та змінному струмі.

Назва роботи англійською:

Research on small-scale superconducting lattice for metrology with direct/alternating current.

Реферат українською:

Досліджено можливості використання інтегральних джозефсонівських SINIS чипів малих розмірів з нанометричними субструктурами для мікрохвильової спектrometerії різноманітних джерел радіовипромінювання. Ці дослідження будуть використані для створення метрологічних пристроїв нового типу, таких як стандарт Вольта змінного струму.

Реферат англійською:

Aim of research engineering is to investigate possibilities of using integral josephson SINIS CHIPS of small-size with nanometric substructures for microwave spectrometry of various radio radiation sources. This research will be used for creation of metrological devices of new type like AC voltage standard.

Індекс УДК: 537.86;621.38.01:53, 537,86;621,38

Коди тематичних рубрик: 29.35

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Мірошніков Анатолій Миколайович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

акт здачі-приймання науково-технічної продукції

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Ларкін Сергій Юрійович

Перелік осіб-виконавців

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

